



تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد فیزیک (حالت جامد)

عنوان:

**محاسبه، لایه‌نشانی و تعیین مشخصه اپتیکی و
الکتریکی پوشش‌های چند لایه شفاف در ناحیه
مرئی و بازتابنده در ناحیه مادون قرمز**

استاد راهنما:

دکتر محمد سعید هادوی

استاد مشاور:

دکتر مجید رشیدی هویه

تحقیق و نگارش:

زهرا شاهی گوافشادی

(این پایان نامه از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بهره مند شده است)

بهمن ۱۳۸۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الهی...

در جلال رحمانی، در کمال سبحانی

نه محتاج زمانی، نه آرزو مند مکانی

نه کس به تو ماند، نه توبه کس مانی

پیدا است که در میان جانی

بلکه جان زنده به خنریست که تو آنی

بسمه تعالی

این پایان نامه با عنوان محاسبه، لایه‌نشانی و تعیین مشخصه اپتیکی و الکتریکی پوشش‌های چند لایه شفاف در ناحیه مرئی و بازتابنده در ناحیه مادون قرمز قسمتی از برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد فیزیک توسط دانشجو زهرا شاهدی گاوافشادی تحت راهنمایی استاد پایان نامه دکتر محمد سعید هادوی تهیه شده است. استفاده از مطالب آن به منظور اهداف آموزشی با ذکر مرجع و اطلاع کتبی به حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان مجاز می باشد.

زهراشاهدی گاوافشادی

این پایان نامه ۸ واحد درسی شناخته می شود و در تاریخ توسط هیئت داوران بررسی و درجه به آن تعلق گرفت.

نام و نام خانوادگی	امضاء	تاریخ
استاد راهنما: دکتر محمد سعید هادوی		
استاد مشاور: دکتر مجید رشیدی هوبه		
داور ۱: دکتر احمد کمپانی		
داور ۲: دکتر ناصر هاتفی		
نماینده تحصیلات تکمیلی:		



دانشگاه سیستان و بلوچستان

تعهدنامه اصالت اثر

اینجانب زهرا شاهی گواشادی تأیید می‌کنم که مطالب مندرج در این پایان‌نامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان‌نامه پیش از این برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو: زهرا شاهی گواشادی

امضاء

تقدیم به:

دوست داشتنی ترین های زندگیم

مادر و پدرم،
پ

به بهترین هایم

خواهران و برادرانم

تقدیم به آنان که دوستان دارم،

و آنان که دوستم دارند.....

سپاسگزاری

بر خود لازم می‌دانم از پدرم و مادرم به عنوان اولین مشوقم در جهت کسب علم صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل آورم. دو نگین تابناک که همچون خورشیدی در پیچ و خم این مسیر تاریک، روشنگر و راهنما بوده‌اند. همچنین از زحمات و فداکاری‌های خواهران و برادران عزیزم که همیشه مشوق من در تحصیل علم بوده‌اند تشکر و قدردانی می‌نمایم. از خداوند متعال برای همه این عزیزان آرزوی طول عمر با عزت و توفیق روز افزون مسئلت می‌نمایم. از دوستان عزیزم که گل وجودشان این کویر را باغی دل انگیز ساخت به خاطر تمام لحظه‌های زیبایی که برایم آفریدند سپاسگزارم و برایشان آرزوی سلامت و بهروزی دارم. از استاد راهنما آقای دکتر سعید هادوی و استاد مشاور دکتر مجید رشیدی که با راهنمایی‌های خود مرا یاری رساندند کمال تشکر را دارم.

چکیده:

در این پروژه پس از لایه‌نشانی ساختارهای لایه نازک SnO_2 و پوشش‌های دوتایی-دوتایی SnO_2 - ZnO ، خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری آنها، همچنین اثر ناخالصی فلئور، F، و نیز تاثیر لایه‌نشانی لایه‌های ضدبازتاب بر روی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

نمونه‌ها به روش "اسپری پایرولیزیز" تهیه سپس مقاومت الکتریکی سطحی، ضریب هال، تراکم ناخالصی و میزان شفافیت در گستره‌ی مرئی این نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میزان عبور لایه‌های ترکیبی SnO_2 - ZnO از نمونه‌ی SnO_2 بالاتر است. در حالی که مقاومت الکتریکی سطحی لایه‌های ترکیبی بیشتر از SnO_2 می‌باشد. گاف انرژی، ضریب جذب و ضریب شکست با استفاده از طیف عبوری اپتیکی تعیین گردید که نشان دهنده‌ی افزایش پهنای گاف انرژی با افزایش تراکم ناخالصی می‌باشد. اثر نشان‌دن لایه‌های ضدبازتاب MgF_2 ، SiO_2 بر پاسخ نوری نمونه‌ها ابتدا شبیه سازی مورد مطالعه قرار گرفت و بدین ترتیب ضخامت بهینه برای لایه‌های ضدبازتاب روی نمونه‌ها تعیین گردید. لایه‌های مورد نظر به کمک دستگاه تبخیر حرارتی VAS بر روی نمونه‌ها نشانده شد. نتایج به دست آمده بیانگر کاهش بازتابش نمونه‌ها و افزایش میزان عبور نوری لایه‌ها می‌باشد.

کلمات کلیدی: لایه نازک، اسپری پایرولیزیز، لایه ضدبازتاب، SnO_2 ، SnO_2 - ZnO ، MgF_2 ، SiO_2

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	فصل اول: معرفی اکسیدهای رسانای شفاف و ویژگی‌های فیزیکی آنها.....
۲	۱-۱- مقدمه
۴	۲-۱- خواص اپتیکی و الکتریکی اکسیدهای رسانای شفاف
۵	۱-۲-۱- خصوصیات الکتریکی اکسیدهای رسانای شفاف
۸	۱-۱-۲-۱- محاسبه ضرایب هدایت الکتریکی، هال، نرنست و سیبک
۱۴	۲-۲-۱- خصوصیات اپتیکی اکسیدهای رسانای شفاف
۱۶	۱-۲-۲-۱- خواص اپتیکی در ناحیه‌ی فرابنفش
۱۸	۳-۲-۱- تاثیر ضخامت بر خواص الکتریکی و اپتیکی لایه‌های نازک رسانای شفاف.....
۱۸	۳-۱- معیارهای انتخاب اکسیدهای رسانای شفاف
۱۸	۱-۳-۱- رسانندگی الکتریکی
۱۹	۲-۳-۱- فرکانس پلاسمایی
۲۰	۳-۳-۱- تابع کار
۲۰	۴-۳-۱- پایداری گرمایی رساناهای شفاف
۲۱	۵-۳-۱- کمترین دمای لایه‌نشانی
۲۱	۶-۳-۱- سدهای نفوذی بین رساناهای شفاف وزیرلایه‌های شیشه‌ای حاوی سدیم
۲۲	۷-۳-۱- الگوی خوردگی در رساناهای شفاف
۲۳	۸-۳-۱- قابلیت دوام شیمیایی
۲۳	۹-۳-۱- پایداری در پلاسمای هیدروژن
۲۳	۱۰-۳-۱- سختی مکانیکی رساناهای شفاف
۲۴	۱۱-۳-۱- هزینه‌های تولید
۲۵	۱۲-۳-۱- سمی بودن

۲۶ فصل دوم: روش‌های تهیه‌ی لایه‌های رسانای شفاف
۲۷ ۱-۲- مقدمه
۲۸ ۲-۲- روش‌های تهیه‌ی لایه‌های نازک
۲۹ ۱-۲-۲- لایه‌نشانی به روش تبخیر حرارتی
۳۲ ۱-۱-۲-۲- فیزیک تبخیر
۳۴ ۲-۱-۲-۲- پارامترهای موثر در کیفیت لایه‌های رشد یافته به روش تبخیر حرارتی
۳۴ ۳-۱-۲-۲- تهیه‌ی لایه نازک به روش تبخیر حرارتی با استفاده از منابع مقاومتی
۳۷ ۴-۱-۲-۲- روش تبخیر با باریکه الکترونی (EBE)
۳۸ ۵-۱-۲-۲- مزایای روش EBE
۳۸ ۶-۱-۲-۲- معایب روش EBE
۳۹ ۷-۱-۲-۲- روش تبخیر لحظه‌ای
۳۹ ۸-۱-۲-۲- تبخیر به روش سیم انفجاری
۳۹ ۹-۱-۲-۲- روش تبخیر واکنش پذیر
۴۰ ۱۰-۱-۲-۲- تبخیر واکنش پذیر فعال شده
۴۰ ۱۱-۱-۲-۲- روش تبخیر لیزری
۴۰ ۱۲-۱-۲-۲- تبخیر با استفاده از قوس الکتریکی
۴۱ ۱۲-۱-۲-۲- تبخیر با استفاده از گرمای امواج RF
۴۱ ۲-۲-۲- لایه‌نشانی به روش کندوپاش (اسپاترینگ)
۴۲ ۱-۲-۲-۲- اسپاترینگ dc
۴۴ ۲-۲-۲-۲- اسپاترینگ RF
۴۵ ۳-۲-۲-۲- کندوپاش واکنش پذیر
۴۶ ۴-۲-۲-۲- کندوپاش مگنترون
۴۶ ۵-۲-۲-۲- کندپاش مگنترون نامتوازن
۴۷ ۶-۲-۲-۲- کندوپاش با ستون یونی
۴۷ ۷-۲-۲-۲- مزایای استفاده از روش کندوپاش در لایه‌نشانی
۴۷ ۸-۲-۲-۲- برخی از معایب کندوپاش

۴۸ لایه‌نشانی به روش اپی‌تکسی باریکه مولکولی (MBE)
۴۹ لایه‌نشانی به روش لیزر پالسی (PLD)
۵۰ لایه‌نشانی به روش بخار شیمیایی (CVD)
۵۰ لایه‌نشانی به روش اسپری پایرولیز
۵۲ جنبه های فیزیکی ۱-۶-۲-۲
۵۳ سینتیک رشد ۲-۶-۲-۲
۵۴ جنبه های شیمیایی ۳-۶-۲-۲
۵۴ اثرات زیرلایه ۴-۶-۲-۲
۵۴ خواص فیزیکی لایه‌های ساخته شده به روش اسپری پایرولیز ۵-۶-۲-۲
۵۵ لایه‌نشانی به روش سل-ژل ۷-۲-۲
۵۵ لایه‌نشانی به روش آباری الکتریکی (الکترولیز)
۵۶ لایه‌نشانی به روش آباری بدون استفاده از جریان الکتریکی ۹-۲-۲
۵۶ لایه‌نشانی به روش آندیزاسیون ۱۰-۲-۲
۵۷ لایه‌نشانی به روش حمام شیمیایی (CBD)
۵۷ روکش دادن یونی واکنش پذیر ۱۲-۲-۲
۵۸ غوطه ور سازی ۱۳-۲-۲
۵۹ فصل سوم: پوشش‌های ضد بازتاب
۶۰ ۱-۳ مقدمه
۶۱ ۲-۳ پوشش‌های ضد بازتاب تک لایه‌ای
۶۴ ۳-۳ پوشش‌های ضد بازتاب دولایه‌ای
۶۷ ۱-۳-۳ ضخامت اپتیکی هر لایه مساوی $\lambda/4$ (پوشش ربع - ربع)
۶۹ ۲-۳-۳ ضخامت اپتیکی مساوی، پوشش‌های غیر ربعی
۷۰ ۳-۳-۳ لایه داخلی $\lambda/2$ ، لایه خارجی $\lambda/4$
۷۱ ۴-۳-۳ ضخامت اپتیکی هر لایه‌ها مضرب صحیحی از $\lambda/4$ نباشد
۷۲ ۴-۳ پوشش‌های ضد بازتاب چند لایه‌ای و نا همگن
۷۵ فصل چهارم: ویژگی‌های فیزیکی رساناهای شفاف ZnO و SnO ₂ و ویژگی‌های

 فیزیکی لایه‌های ضدبازتاب MgF_2 و SiO_2
۷۶ ۱-۴- مقدمه
۷۶ ۲-۴- بررسی ویژگی‌های لایه‌های نازک اکسید روی
۷۶ ۱-۲-۴- خواص ساختاری لایه‌های نازک اکسید روی
۷۸ ۲-۲-۴- خواص الکتریکی لایه‌های نازک اکسید روی
۷۹ ۳-۲-۴- خواص اپتیکی لایه‌های نازک اکسید روی
۷۹ ۳-۴- تاثیر آلاینده‌های متفاوت بر روی لایه‌های نازک اکسید روی
۷۹ ۱-۳-۴- بررسی اثر آلاینده‌ها بر ساختار لایه‌های نازک اکسید روی
۸۰ ۲-۳-۴- تاثیر آلاینده‌ها بر خواص اپتیکی لایه‌های نازک اکسید روی
۸۲ ۳-۳-۴- تاثیر آلاینده‌ها بر خواص الکتریکی لایه‌های نازک اکسید روی
۸۴ ۴-۴- بررسی ویژگی‌های لایه‌های نازک اکسید قلع
۸۴ ۱-۴-۴- خواص ساختاری لایه‌های نازک اکسید قلع
۸۴ ۲-۴-۴- خواص الکتریکی لایه‌های نازک اکسید قلع
۸۵ ۳-۴-۴- خواص اپتیکی لایه‌های نازک اکسید قلع
۸۵ ۵-۴- تاثیر آلاینده‌های متفاوت بر خواص لایه‌های نازک اکسید قلع
۸۵ ۱-۵-۴- بررسی ساختار اثر آلاینده‌ها بر لایه‌های نازک اکسید قلع
۸۶ ۲-۵-۴- تاثیر آلاینده‌ها بر خواص اپتیکی لایه‌های نازک اکسید قلع
۸۷ ۳-۵-۴- تاثیر آلاینده‌ها بر خواص الکتریکی لایه‌های نازک اکسید قلع
۸۸ ۶-۴- بررسی ویژگی‌های SiO_2 و MgF_2
۸۸ ۱-۶-۴- مقدمه
۸۹ ۲-۶-۴- خواص ساختاری پوشش‌های SiO_2 و MgF_2
۹۰ ۳-۶-۴- خواص اپتیکی SiO_2 و MgF_2
۹۳ فصل پنجم: بحث و بررسی نتایج تجربی
۹۴ ۱-۵- مقدمه
۹۴ ۲-۵- تهیه لایه‌های نازک اکسیدهای رسانای شفاف

۹۴ ۱-۲-۵ آماده سازی محلول اسپری
۹۴ ۱-۱-۲-۵ آماده سازی محلول اسپری برای تهیه ی لایه های نازک اکسید قلع
۹۵ ۲-۱-۲-۵ آماده سازی محلول اسپری برای تهیه ی لایه های دوتایی $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$
۹۶ ۲-۲-۵ شرایط لایه نشانی
۹۷ ۳-۲-۵ توجیه واکنش های شیمیایی انجام شده در خلال فرایند پیرولیز
۹۷ ۳-۵ بررسی ویژگی های الکتریکی
۹۸ ۱-۳-۵ اندازه گیری مقاومت الکتریکی
۱۰۲ ۲-۳-۵ اندازه گیری ضریب هال و تعیین تراکم حامل ها
۱۰۶ ۴-۵ بررسی ویژگی های اپتیکی
۱۰۶ ۱-۴-۵ بررسی طیف عبوری
۱۱۰ ۲-۴-۵ بررسی اثرات ضد بازتاب بر روی طیف عبوری
۱۱۱ ۱-۲-۴-۵ طراحی و بهینه سازی لایه ها
۱۱۶ ۳-۴-۵ محاسبه ضرایب شکست، ضخامت لایه ها و پهنای گاف انرژی
۱۳۱ ۵-۵ بررسی ویژگی های ساختاری
۱۳۴ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۳۵ ۱-۶ نتیجه گیری
۱۳۶ ۲-۶ پیشنهادات
۱۳۷ مراجع
۱۴۲ پیوست

فهرست جدول ها

صفحه	عنوان جدول
۱۹	جدول ۱-۱ فرکانس پلاسمایی چند اکسید رسانای شفاف
۲۰	جدول ۲-۱ توابع کار اندازه‌گیری شده برای چند رسانای شفاف
۲۱	جدول ۳-۱ دمای پایداری چند نمونه از اکسیدهای رسانای شفاف
۲۳	جدول ۴-۱ برخی از مواد شیمیایی مورد استفاده برای خوردگی در رساناهای شفاف
۲۴	جدول ۵-۱ مقادیر سختی رساناهای شفاف
۴۹	جدول ۱-۲ انرژی فوتون گسیلی در گازها
۷۳	جدول ۱-۳: پوشش‌های ضدبازتاب عملی برای چند زیرلایه متداول
۷۸	جدول ۱-۴ برخی از خواص اکسید روی
۹۵	جدول ۱-۵ مقادیر جرمی متناسب با درصدهای اتمی متفاوت فلوئور
۹۵	جدول ۲-۵ مقادیر جرمی متناسب با درصدهای اتمی متفاوت روی
۹۶	جدول ۳-۵ مقادیر جرمی متناسب با درصدهای وزنی متفاوت فلوئور
۹۸	جدول ۴-۵ مقاومت سطحی SnO_2 بر حسب درصد ناخالصی F با مقدار محلول اسپری شده 10CC و دمای زیرلایه 500°C
۹۹	جدول ۵-۵ مقاومت سطحی $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ بر حسب درصد ناخالصی Zn با مقدار محلول اسپری شده 10CC و دمای زیرلایه 480°C
۱۰۰	جدول ۶-۵ مقاومت سطحی $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ بر حسب درصد ناخالصی F با مقدار محلول اسپری شده 10CC و دمای زیرلایه 480°C
۱۰۱	جدول ۷-۵ مقاومت الکتریکی ویژه نمونه‌های تهیه شده SnO_2 با درصد ناخالصی متفاوت F با مقدار محلول اسپری شده 10CC و دمای زیرلایه 500°C

- ۱۰۱ جدول ۵-۸ مقاومت الکتریکی ویژه نمونه‌های تهیه شده $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با درصد ناخالصی متفاوت Zn با مقدار محلول اسپری شده 10°C و دمای زیرلایه 480°C
- ۱۰۲ جدول ۵-۹ مقاومت الکتریکی ویژه نمونه‌های تهیه شده $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با درصد ناخالصی متفاوت F با مقدار محلول اسپری شده 10°C و دمای زیرلایه 480°C
- ۱۰۳ جدول ۵-۱۰ ضریب هال و تراکم حامل نمونه‌های تهیه شده SnO_2 با درصد ناخالصی متفاوت F با مقدار محلول اسپری شده 10°C و دمای زیرلایه 500°C
- ۱۰۴ جدول ۵-۱۱ ضریب هال و تراکم حامل نمونه‌های تهیه شده $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با درصد ناخالصی متفاوت Zn با مقدار محلول اسپری شده 10°C و دمای زیرلایه 480°C
- ۱۰۵ جدول ۵-۱۲ ضریب هال و تراکم حامل نمونه‌های تهیه شده $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با درصد ناخالصی متفاوت F با مقدار محلول اسپری شده 10°C و دمای زیرلایه 480°C
- ۱۱۸ جدول ۵-۱۳ ضخامت‌های محاسبه شده با استفاده از برنامه کامپیوتری **PARAV**
- ۱۲۷ جدول ۵-۱۴ پهنای گاف انرژی نمونه‌های تهیه شده SnO_2 با درصد ناخالصی متفاوت F با مقدار محلول اسپری شده 10°C و دمای زیرلایه 500°C
- ۱۲۸ جدول ۵-۱۵ پهنای گاف انرژی نمونه‌های تهیه شده $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با درصد ناخالصی متفاوت Zn با مقدار محلول اسپری شده 10°C و دمای زیرلایه 480°C
- ۱۲۸ جدول ۵-۱۶ پهنای گاف انرژی نمونه‌های تهیه شده $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با درصد ناخالصی متفاوت F با مقدار محلول اسپری شده 10°C و دمای زیرلایه 480°C

فهرست شکل ها

صفحه	عنوان شکل
۸	شکل ۱-۱ پیکان‌ها جهت حرکت الکترون‌ها از انتهای گرم قطعه به سوی انتهای سرد را نشان می‌دهند که سبب ایجاد یک میدان الکتریکی در دو سر قطعه می‌گردد
۱۰	شکل ۲-۱ اختلاف دمای مشاهده شده در اثر نرنست
۱۱	شکل ۳-۱ حامل‌های بار حفره‌ها هستند
۱۲	شکل ۴-۱ نقش زمان واهلش در حضور میدان‌های متقاطع الکتریکی و مغناطیسی زمان کوتاه واهلش منجر به کوچک شدن زاویه هال ، φ می‌شود و با زیاد شدن زمان واهلش زاویه φ بزرگتر می‌شود
۳۰	شکل ۱-۲ طرح کلی دستگاه تبخیر حرارتی
۳۳	شکل ۲-۲ منحنی تغییرات فشار بخار برای چند ماده برحسب درجه حرارت
۳۴	شکل ۳-۲ نمایش منحنی‌های تجربی انتقال اتم‌های ماده هدف به سطح زیرلایه
۳۶	شکل ۴-۲ منابع مقاومتی گرافیت و تنگستن
۳۸	شکل ۵-۲ نمایش انواع تفنگ های الکترونی مورد استفاده در تبخیر حرارتی
۴۲	شکل ۶-۲ طرح کلی کندوپاش
۴۳	شکل ۷-۲ طرح دستگاه کندوپاش دوقطبی
۴۴	شکل ۸-۲ طرح دستگاه کندوپاش سه قطبی
۴۵	شکل ۹-۲ طرح یک دستگاه کندوپاش دو قطبی RF
۴۶	شکل ۱۰-۲ طرح کلی منبع کندوپاش مگنترون
۴۸	شکل ۱۳-۲ نمایش کلی یک دستگاه لایه‌نشانی MBE
۵۱	شکل ۱۴-۲ طرح کلی از یک دستگاه اسپری پایرولیزیز
۵۲	شکل ۱۵-۲ انواع نازل

شکل ۳-۱ بازتابندگی قائم برای یک لایه به ضخامت اپتیکی ربع طول موج با ضریب

$$\frac{n_1}{(n_0 n_s)^{1/2}} \text{ بر روی زیرلایه‌ای به ضریب شکست } n_s \text{ برحسب تابعی از}$$

شکل ۳-۲ منحنی‌های محاسبه شده بازتابندگی برحسب طول موج برای یک ضخامت ربع

طول موج از یک پوشش ضدبارتاب و MgF_2 در روی شیشه در زوایای تابش مختلف

شکل ۳-۳ منحنی‌های بازتابندگی برحسب طول موج برای انواع مختلف پوشش‌های

ضدبارتاب در روی Ge

شکل ۳-۴ نمودار شوستر

شکل ۳-۵: میزان عبور اپتیکی یک زیرلایه Ge پوشیده شده در دو طرف با لایه ناهمگن

$Ge - MgF_2$ به ضخامتی فیزیکی $1/2 \mu_m$

شکل ۴-۱ شبکه بلوری ZnO

شکل ۴-۲ نمونه پراش X-ray لایه ZnO آلیبده با In و Ga

شکل ۴-۳ طیف عبوری لایه‌های نازک ZnO آلیبده شده با Ga و B

شکل ۴-۴ نمودار $(\alpha h\nu)^2$ برحسب انرژی فوتون لایه‌های نازک ZnO آلیبده شده با In

شکل ۴-۵ تغییرات مقاومت الکتریکی و تغییرات تراکم حامل‌ها با غلظت آلاینده در لایه‌های

نازک ZnO

شکل ۴-۶ تغییر تحرک پذیری هال (μ_h) با غلظت آلاینده در لایه‌های نازک ZnO

شکل ۴-۷ نمونه پراش X-ray لایه SnO_2 آلیبده با In در دماهای متفاوت $400-800^\circ C$

شکل ۴-۸ طیف عبوری لایه‌های نازک SnO_2 آلیبده شده با Sb

شکل ۴-۹ تغییرات مقاومت الکتریکی، تراکم حامل‌ها و تحرک پذیری هال (μ_h) با تراکم

آلاینده در لایه‌های نازک SnO_2

شکل ۴-۱۰ نمونه پراش X-ray و سایز دانه‌ها از لایه MgF_2

شکل ۴-۱۱ شاخص شکست برای لایه SiO_2

شکل ۴-۱۲ طیف عبوری از SiO_2

شکل ۴-۱۳ طیف عبوری از MgF_2 با افزایش دما

شکل ۵-۱ سطحی نوعی از نمونه‌های الکتروگذاری شده (قسمت سایه زده شده مربوط به

الکترودهای مسی است)

- ۹۹ شکل نمودار ۲-۵ نمودار مقاومت سطحی SnO_2 بر حسب ناخالصی F با مقدار محلول اسپری شده ۱۰ cc و دمای زیرلایه 50.0°C
- ۱۰۰ شکل نمودار ۳-۵ نمودار مقاومت سطحی $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ بر حسب آلاینده‌گی Zn با مقدار محلول اسپری شده ۱۰ cc و دمای زیرلایه 48.0°C
- ۱۰۰ شکل نمودار ۴-۵ نمودار مقاومت سطحی $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ بر حسب آلاینده‌گی F با مقدار محلول اسپری شده ۱۰ cc و دمای زیرلایه 48.0°C
- ۱۰۳ شکل ۵-۵ نمونه قرار گرفته در میدان مغناطیسی و نحوه اندازه‌گیری ولتاژ هال
- ۱۰۴ شکل ۶-۵ نمودار تغییرات تراکم حامل با درصد ناخالصی F برای نمونه‌های SnO_2 با مقدار محلول اسپری شده ۱۰cc و دمای زیرلایه 50.0°C
- ۱۰۵ شکل ۷-۵ نمودار تغییرات تراکم حامل با درصد ناخالصی Zn برای نمونه‌های $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با مقدار محلول اسپری شده ۱۰cc و دمای زیرلایه 48.0°C
- ۱۰۶ شکل ۸-۵ نمودار تغییرات تراکم حامل با درصد ناخالصی F برای نمونه‌های $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با مقدار محلول اسپری شده ۱۰cc و دمای زیرلایه 48.0°C
- ۱۰۷ شکل ۹-۵ طیف عبوری اپتیکی لایه‌های نازک SnO_2 با تراکم ناخالصی متفاوت با مقدار محلول اسپری شده ۱۰cc و دمای زیرلایه 50.0°C
- ۱۰۸ شکل ۱۰-۵ طیف عبوری اپتیکی لایه‌های نازک $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با تراکم ناخالصی متفاوت Zn با مقدار محلول اسپری شده ۱۰cc و دمای زیرلایه 48.0°C
- ۱۰۹ شکل ۱۱-۵ طیف عبوری اپتیکی لایه‌های نازک $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با تراکم ناخالصی متفاوت F برای مقدار ثابت 0.2g Zn با مقدار محلول اسپری شده ۱۰cc و دمای زیرلایه 48.0°C
- ۱۱۰ شکل ۱۲-۵ طیف عبوری اپتیکی لایه‌های نازک $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ و SnO_2 با مقدار محلول اسپری شده ۱۰cc و دمای زیرلایه 48.0°C
- ۱۱۳ شکل ۱۳-۵ ساختار شماتیک پوشش چند لایه $\text{TCO}/\text{MgF}_2/\text{SiO}_2$ زیرلایه
- ۱۱۴ شکل ۱۴-۵ طیف عبوری اپتیکی لایه SnO_2 با لایه ضد بازتاب MgF_2
- ۱۱۴ شکل ۱۵-۵ طیف عبوری اپتیکی لایه SnO_2 با لایه ضد بازتاب MgF_2 با برنامه نویسی

- ۱۱۵ شکل ۱۶-۵ طیف عبوری اپتیکی لایه $\text{SnO}_2\text{-ZnO:F}$ با یک لایه وبدون لایه ضد بازتاب MgF_2
- ۱۱۶ شکل ۱۷-۵ طیف عبور اپتیکی لایه $\text{SnO}_2\text{-ZnO:F}$ با یک لایه، دو لایه و بدون لایه ضدبازتاب
- ۱۱۹ شکل ۱۸-۵ نمودار تعیین گاف انرژی بر حسب $h\nu$ مربوط به نمونه SnO_2 خالص
- ۱۲۰ شکل ۱۹-۵ نمودار تعیین گاف انرژی بر حسب $h\nu$ مربوط به نمونه $\text{SnO}_2\text{:F}$ با تراکم $0/05$ گرم
- ۱۲۱ شکل ۲۰-۵ نمودار تعیین گاف انرژی بر حسب $h\nu$ مربوط به نمونه $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با تراکم ناخالصی $\text{Zn } 0/2$ g
- ۱۲۲ شکل ۲۱-۵ نمودار تعیین گاف انرژی بر حسب $h\nu$ مربوط به نمونه $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با تراکم ناخالصی $\text{Zn } 0/3$ g
- ۱۲۳ شکل ۲۲-۵ نمودار تعیین گاف انرژی بر حسب $h\nu$ مربوط به نمونه $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با تراکم ناخالصی $\text{Zn } 0/5$ g
- ۱۲۴ شکل ۲۳-۵ نمودار تعیین گاف انرژی بر حسب $h\nu$ مربوط به نمونه $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ با تراکم ناخالصی $\text{Zn } 2$ g
- ۱۲۵ شکل ۲۴-۵ نمودار تعیین گاف انرژی بر حسب $h\nu$ مربوط به نمونه $\text{SnO}_2\text{-ZnO:F}$ با تراکم ناخالصی $\text{F } 0/05$ g
- ۱۲۶ شکل ۲۵-۵ نمودار تعیین گاف انرژی بر حسب $h\nu$ مربوط به نمونه $\text{SnO}_2\text{-ZnO:F}$ با تراکم ناخالصی $\text{F } 0/2$ g
- ۱۲۷ شکل ۲۶-۵ نمودار تعیین گاف انرژی بر حسب $h\nu$ مربوط به نمونه $\text{SnO}_2\text{-ZnO:F}$ با تراکم ناخالصی $\text{F } 0/4$ g
- ۱۲۹ شکل ۲۷-۵ وابستگی n به طول موج در فیلم $\text{SnO}_2\text{:F}$ ($\text{F } 0/05\text{wt}\%$) با ضخامت 200 nm
- ۱۳۰ شکل ۲۸-۵ وابستگی n به طول موج در فیلم $\text{SnO}_2\text{-ZnO}$ ($\text{Zn } 0/2\text{wt}\%$) با ضخامت 350 nm
- شکل ۲۹-۵ وابستگی n به طول موج در فیلم $\text{SnO}_2\text{-ZnO:F}$ ($\text{F } 0/2\text{wt}\%$) با ضخامت 370 nm
- ۱۳۱

